

# DIN 51390-4:2000-11 (D)

## Prüfung von Mineralölerzeugnissen - Bestimmung des Siliciumgehaltes - Teil 4: Direkte Bestimmung durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv angekoppeltem Plasma (ICP OES)

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
Vorwort .....		1
1	Anwendungsbereich .....	1
2	Normative Verweisungen .....	1
3	Einheit.....	1
4	Prinzip.....	2
5	Bezeichnung .....	2
6	Geräte .....	2
7	Chemikalien .....	2
8	Aufstellen der Silicium-Bezugskurve .....	2
9	Probenvorbereitung .....	2
10	Durchführung.....	2
11	Auswertung.....	2
12	Angabe der Ergebnisse .....	3
13	Präzision des Verfahrens .....	3
13.1	Wiederholbarkeit ( <i>r</i> ) .....	3
13.2	Vergleichbarkeit ( <i>R</i> ) .....	3